



# 中華民國專利證書

新型第 M391645 號

新型名稱：厚度量測裝置

專利權人：國立臺灣大學

創作人：范光照、陳守恆

專利權期間：自 2010 年 11 月 1 日至 2020 年 7 月 4 日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權  
行使專利權依法應提示新型專利技術報告進行警告

經濟部智慧財產局 局長

王美花

中華民國 105 年 6 月 22 日 (換發)

